

即时发布

投资者关系:

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系:

Becky Howland 博士

企业通讯高级总监

(408) 875-9350

becky.howland@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出针对光学和 EUV 空白光罩的 全新 FlashScan™ 产品线

加利福尼亚州米尔皮塔斯市，2017 年 8 月 15 日 -- 今天，[KLA-Tencor](#) 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）宣布推出全新的 FlashScan™ 空白光罩*检测产品线。自从 1978 年公司推出第一台检测系统以来，KLA-Tencor 一直是图案光罩检测的主要供应商，新的 FlashScan 产品线宣告公司进入专用空白光罩的检验市场。光罩坯件制造商需要针对空白光罩的检测系统，用于工艺开发和批量生产过程中的缺陷检测，此外，光罩制造商（“光罩厂”）为了进行光罩原料检测，设备监控和进程控制也需要购买该检测系统。FlashScan 系统可以检查针对光学或极紫外（EUV）光刻的空白光罩。

“先进的光刻技术从表征良好的空白光罩开始。” KLA-Tencor 的光罩和宽带等离子晶圆检测部总经理熊亚霖博士指出，“无缺陷的 EUV 光罩坯件极难制造，这不仅推高了生产成本，也推延了 EUV 光刻可能带给新一代芯片制造的惠益。我们全新的 FlashScan 空白光罩检测仪可以在裸基板，吸收膜和光阻涂层上捕获各种类型的缺陷。此外，对比目前市场上的其他系统，FlashScan 系统具有更高的产量和灵敏度，这将缩短空白光罩制造商和光罩厂的学习周期时间。”

利用 KLA-Tencor 晶圆缺陷检测系统的激光散射技术，FlashScan 系统可以满足目前所有正在开发和生产的光学与 EUV 空白光罩对于灵敏度和检测速度要求。采用光罩检测市场独特的三通道数据采集系统，该系统可以对各种类型的光罩坯件的缺陷进行检测、尺寸测量和区分，例如在空白光罩制造或运输期间可能出现在光阻上的针孔和掉落颗粒。

领先的光罩厂对高灵敏度、高产量和全类型的缺陷检测系统显示了浓厚的兴趣，这证明了市场对该产品的需求。为了保证空白和图案光罩制造商所需的优异性能和产量，FlashScan 系统由 [KLA-Tencor 全球综合服务网络](#) 提供技术支持。有关新 FlashScan 产品系列的更多信息（包括当前型号的说明）请查阅 [FlashScan 的网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是全球领先的工艺控制及良率管理解决方案的设备供应商。该公司与全球的

客户合作，开发最先进的检测和度量技术，致力服务于半导体、LED 等相关纳米电子工业。凭借业界标准产品组合和世界一流的工程师科学家团队，公司 40 余年来持续为客户打造卓越的解决方案。KLA-Tencor 公司的总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯市（milpitas），并在全球设有专属的客户运营和服务中心。更多相关信息，请访问公司网站 <http://www.kla-tencor.com/> (KLAC-P)。

前瞻性声明：

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 FlashScan 系统的预期性能的声明以及空白光罩中缺陷减少对 EUV 光刻的效益影响，都是前瞻性陈述，并且符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中“安全港”（Safe Harbor）条款的规定。这些前瞻性声明基于目前的资讯及预期，并且受到诸多风险与不确定性影响。由于各种实际因素，例如（由于成本、性能抑或其他原因造成的）新技术推迟、其他公司推出竞争性产品、或影响 KLA-Tencor 产品的实施、性能或使用的意外技术挑战或限制等影响，实际结果可能与此类声明中的预计结果大相径庭。

*空白光罩是指用于制作图案光罩的复合基板。

###